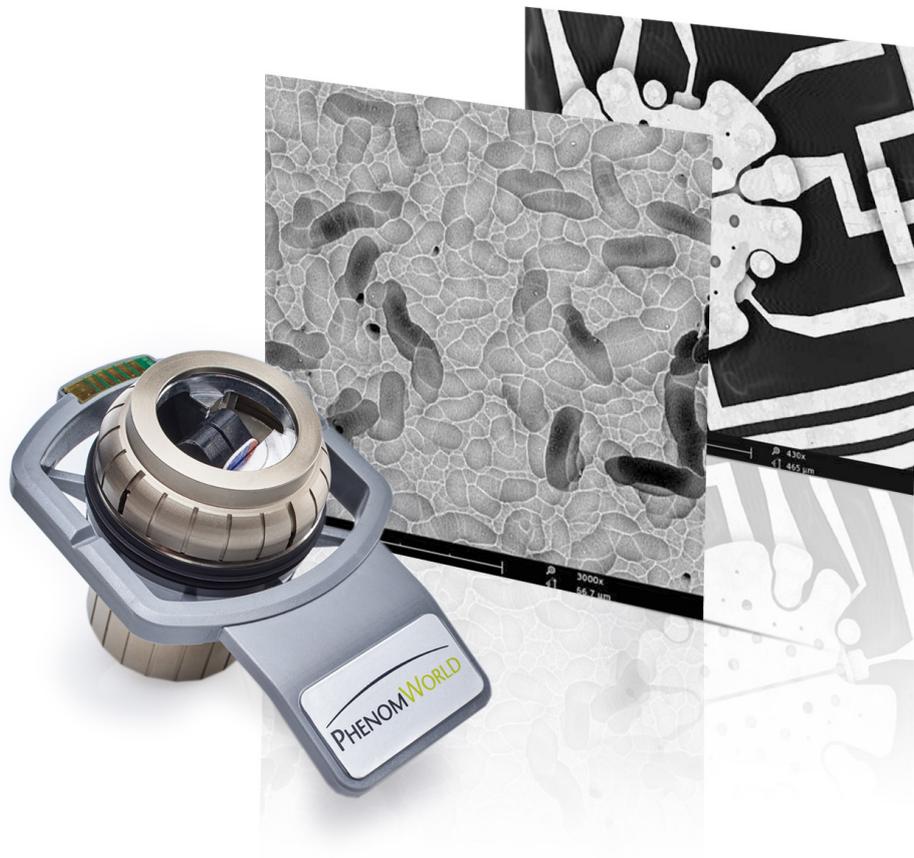


样品杯插件



插入式制样，更加快速简便

可以用微电子器件插件和断面插件来扩展金相样品杯和降低荷电金相样品杯的功能。这类插件的设计，是为了更方便地在飞纳台式扫描电镜（SEM）上观察特定种类的样品。借助插件样品也大幅提高了观察效率。



用微电子器件插件制备样品

微电子器件插件

通常用来观察微电子器件、太阳能电池和其他需要非破坏制样的晶片样品，使样品在观察后可以被再利用。

通常，在电子显微镜下观察或分析的样品都粘在铝制支架上。在使用后取下样品可能会污染甚至破坏样品。研发微电子器件插件就是为了解决这个问题。其独特的固定方式避免了胶水或其他粘合剂的使用。

市面上的其他夹具，要求表面接触样品。这常常导致样品表面损伤和模糊。微电子器件插件接触样品表面的方式是：夹脚可以有效固定样品，受力均匀地分布在 16 根夹脚上。

规格参数

- 样品大小：
在 10 mm x 10 mm 和 19 mm x 19 mm 之间最大厚度为 1.5mm
- 不需要工具
- 不用接触样品表面
- 样品观察后即可轻松取出
- 使用后保持样品最初状态



用断面插件制备样品

断面插件

断面插件一般与金相样品杯结合使用。样品横截面成像的制备是一个耗时的过程。样品通常嵌入抛光。使用断面插件，样品很容易在支架中使用夹具固定。无需工具就可以快速、轻松地调整样品位置。使用断面插件观察样品，可以保存样品的最初状态，可以在生产过程中重复使用或在进一步的实验室研究中使用。

观察涂层、多层半导体和断裂表面时需要断面制样。一般来说，这类样品都需要借助树脂固定制作成镶嵌样，耗费大量时间和精力。

有了断面插件，就再也不需要螺丝钉和特殊工具来固定样品了。

规格参数

- 样品大小：
15mm x 25mm (W x L) 最厚为 10 mm
- 不需要工具
- 样品定位简单
- 保持样品原始形貌

